



Daitron Chip LaserDiode Tester

本装置はレーザーダイオードの特性検査装置です。

高速 Pulse 駆動、CW 駆動により電氣的及び光学的な測定が可能です。

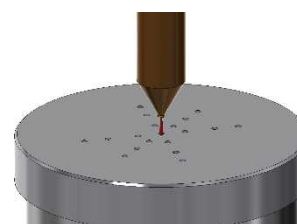


Key features

- ▶ 品種切り替え対応デバイスローダアンローダ搭載
- ▶ I_{th} 、 V_{th} 付近の詳細計測可能
- ▶ バック光専用測定を搭載
- ▶ 常温及び高温試験を一気に測定可能
- ▶ 測定ステージは 6 式から必要な計測を選択可能

Functions

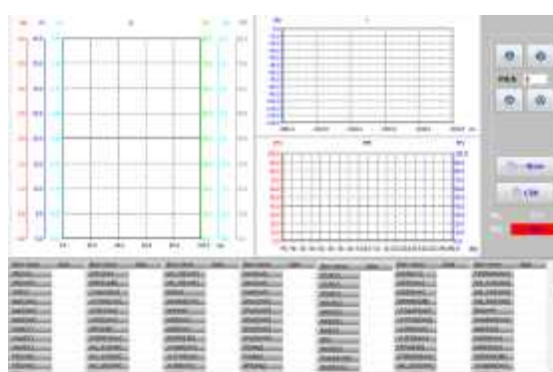
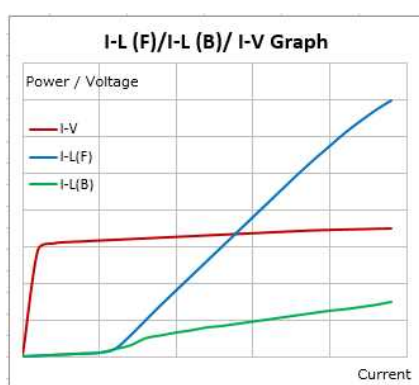
- ▶ デバイスへのダメージ軽減
- ▶ プローブ時のデバイスズレ軽減
- ▶ 低接触抵抗特殊ステージ



↑ ダメージ軽減／高速ピックアップ

Applications

- ▶ I-L 測定
- ▶ 波長測定
- ▶ I-L(B)測定
- ▶ DC 測定 (I_r / V_r)
- ▶ FFP 測定 (Option)



↑ デバイス測定画面(測定グラフ&測定データ)

Pulse Driver

Driver Line up	Current	Pulse Width
Standard CW Driver (Low)	~1A	CW

Details

装置諸元	
・筐体寸法	1850(W)×~1500(D)×~1850(H) mm
・ユーティリティ	電源：三相 AC200V±10% 60A 1系統 空圧源：要 真空源：要
・重量	約 1800kg
標準機能	
・対象デバイス (参考)	LD チップ
・供給形態	グリップリング
・収納形態	グリップリング、2 インチゲルパック
・電流測定	1A (最大 1A まで仕様に合わせてレンジ変更可)
・電圧測定	5V
・光出力測定	0.02~30mW/30~90mW (2 レンジ)
・波長範囲	長波長 / 短波長
・温度制御範囲	常温：+25~+30℃ 高温：+25~+100℃
・タクトタイム (参考)	~7.0sec ※測定条件によって変わります
・安全機能	オープンショートチェック / フェイルチェック / 通電安全チェック 変動監視機能 / リミット監視機能
測定機能	
・標準取得データ	IL : Iop / Vop / Ith / Vth / Pop / Eta / Rd / Kink λ : λp / λd / λw/SMSR DC : LDVf/ LDIr ILB : BPo / BfPo
・オプション	FFP : θ// / θ⊥ / Δθ// / Δθ⊥
※その他計測項目に関してもご対応可能です。	
※IL&DC 以外の測定項目は測定光学系及び測定器に依存します。	
※Pulse 性能に関しては対象デバイス及びパッケージの影響に依存します。	
※デバイス治具・温調ステージ等もカスタム対応可能です。	

お問い合わせ先
ダイトロン株式会社 D&P カンパニー 計測機器工場 亀岡 営業担当
〒621-0013 京都府亀岡市大井町並河 3-13-1
TEL 0771-24-1011(代) <http://www.daitron.co.jp>

製品ホームページ
(チップテスト)



問い合わせ装置番号：DCLT-6300